

О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЯРКОСТИ ПО ФРАГМЕНТАМ  
МОДУЛЯ ЕГО ФУРЬЕ-ОБРАЗА

И. Г. Косарев, И. Ф. Малов, В. А. Фролов

УДК 520.27 + 520.874

На основе модельных расчетов показано, что минимально-фазовый метод позволяет восстановить исходный профиль по фрагментам модуля его фурье-спектра. Оценено влияние ошибок в измеренном модуле на качество восстановления.

Как показано в работах /1-3/, минимально-фазовые профили, полученные по модулю фурье-спектра  $G(\omega) = \Gamma(\omega)e^{i\Phi(\omega)}$  с помощью преобразований Гильберта (ПГ)

$$\Phi(\omega_x) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln \Gamma(\omega) d\omega}{\omega - \omega_x}, \quad (1)$$

$$\ln \Gamma(\omega_x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\omega) d\omega}{\omega - \omega_x} \quad (2)$$

и обратного фурье-преобразования (ФИ), оказываются в целом ряде случаев очень близкими к модельным профилям. В работах /2, 3/ считалось, что модуль  $\Gamma(\omega)$  известен точно и на всей оси частот. На практике (например, при радиоастрономических наблюдениях) интервал измерений всегда ограничен, а сам модуль из-за наличия шумов определяется с некоторой погрешностью. В связи с этим представляет интерес исследование влияния конечности интервала измерений и шумов на качество восстанавливаемых профилей. Этому вопросу и посвящена настоящая работа.

В /I/ было проведено восстановление модельного профиля по последовательно уменьшающим фрагментам модуля его Фурье-спектра с помощью интегрального уравнения (2). Здесь с той же целью использовалась квадратурная формула (1). Результаты иллюстрируются двумя моделями

$$E_1(x) = e^{-(x-1)^2} + 0,5e^{-(x-4)^2}, \quad (3)$$

$$E_2(x) = e^{-(x-2)^2} + e^{-0,16(x-5)^2}, \quad (4)$$

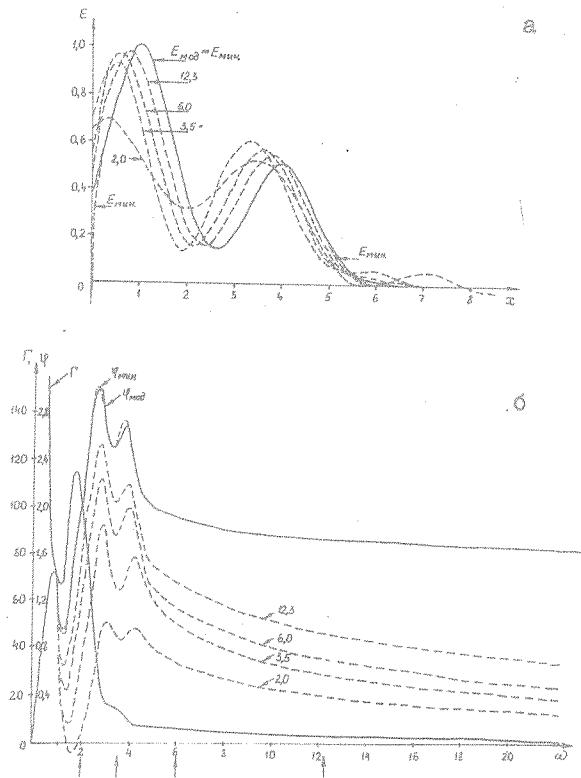
приведенными на рис. I-2. Стрелками на этих рисунках отмечены значения граничных частот интервала задания ( $\omega = \omega_{\text{гр}}$ ) модуля  $\Gamma(\omega)$  и указаны кривые  $E(x)$  и  $\varphi(\omega)$ , соответствующие этим фрагментам модуля. При расчетах  $\Phi_{\min}$  использовалось значение  $\omega_{\text{гр}}$  порядка нескольких сотен.

На приведенных рисунках видно, что с уменьшением  $\omega_{\text{гр}}$   $E(x)$ , все более смещается относительно  $E_{\text{мод}}$  в сторону  $x = 0$ . При некотором значении  $\omega_{\text{гр}}$  восстановленные профили теряют основные характерные признаки. Так, на рис. 2 профиль  $E_{2,5}$  является двухкомпонентным, в то время как в  $E_{1,0}$  уже остается только один компонент.

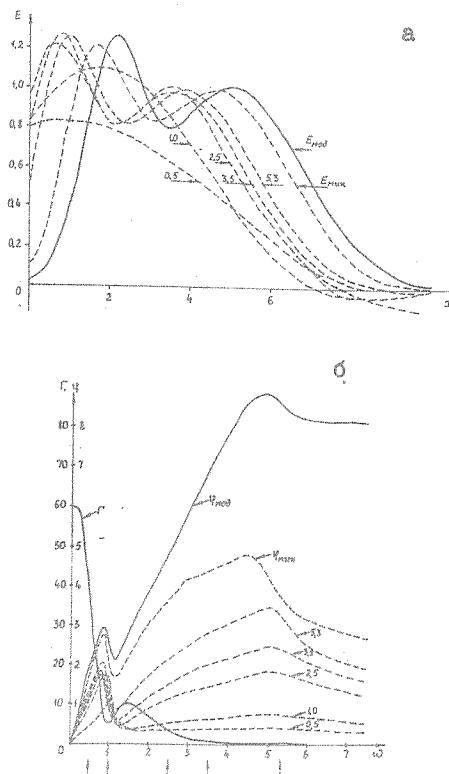
Интересно отметить, что во всех рассмотренных примерах  $\varphi(\omega)$  сохраняет характерные детали даже на тех частотах, где информация о модуле уже отсутствует.\*). На рис. I при  $\omega_{\text{гр}} = 2$  у кривой  $\varphi_{2,0}(\omega)$  явно выражены два компонента на интервале  $2 < \omega < 5$ . На рис. 2 при  $\omega_{\text{гр}} = 0,5$  у  $\varphi_{0,5}(\omega)$  четко определяется максимум в районе  $\omega \sim 1$  и заметен максимум при  $\omega \sim 5$ . Этот результат дает возможность предложить методику улучшения восстановленных профилей с помощью многократного применения ИГ и ПИ. Возможную схему итераций можно, например, представить в следующем виде:

\*). Аналогичные выводы можно сделать по результатам работы /I/.

$$\begin{aligned}
 \Gamma_0(\omega) &\rightarrow \varphi_0(\omega) \rightarrow E_0(x) \rightarrow \Gamma_1(\omega) \rightarrow \varphi_1(\omega) \rightarrow E_1(x) \dots \\
 &\dots \rightarrow \Gamma_n(\omega) \rightarrow \varphi_n(\omega) \rightarrow E_n(x).
 \end{aligned} \tag{5}$$



Р и с. I. а) Модельный профиль (сплошная кривая) и минимально-фазовые профили (пунктир), соответствующие указанным значениям  $\omega_{\text{тр}}$  для  $E_1(x)$  (формула (3)); б) зависимость  $\Gamma$ ,  $\varphi_{\text{mod}}$  и  $\varphi_{\text{min}}$  от частоты при различных значениях  $\omega_{\text{тр}}$



Р и с. 2. То же, что и на рис. I для  $E_2(x)$  (формула (4))

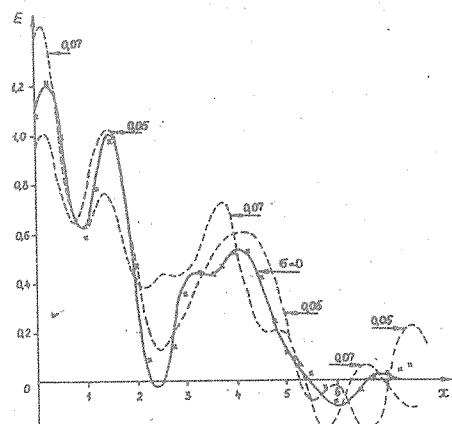
Если процедура окажется сходящейся, можно надеяться на увеличение разрешающей способности по сравнению с той, которая достигается непосредственно в эксперименте. Так, в нашем случае (рис. 2) этот метод итераций может "обнаружить" второй компонент даже при начальном модуле, измеренном до  $\omega_{\text{гр}} = 0,5 - I$ .

В работе /4/ указана сходящаяся итерационная процедура восстановления оптического изображения по фазовой информации с помощью многократного применения ФП.

Полученные результаты приводят к предположению о том, что во фрагментах амплитудного распределения Фурье-образа содержится определенная информация обо всем исходном профиле. Вытекающие отсюда возможности аналогичны известным из голографии возможностям восстановления полного изображения объекта по фрагментам голограмм.

Для оценки влияния ошибок в измеренных значениях модуля  $G(\omega)$  на вид восстанавливаемого профиля  $E(x)$  мы использовали данные о космическом радиоисточнике Р 0349-27 /5/. В измеренный модуль пространственного спектра этого источника при численном счете методом случайной выборки были введены ошибки со среднеквадратичными отклонениями  $\sigma = 0,02; 0,05$  и  $0,07$ . Восстановленные при этих значениях  $\sigma$  профили изображены на рис. 3. Крестиками показаны значения  $E(x)$  для  $\sigma = 0,02$ , близкие к соответствующим значениям при  $\sigma = 0$ .

Результаты расчетов свидетельствуют о достаточной устойчивости метода. Так, при 7%-ной ошибке в восстановленном профиле сохраняются все информационные детали, хотя относительные интенсивности отдельных компонентов несколько искажены.



Р и с. 3. Минимально-фазовые стрип-распределения для космического радиоисточника Р 0349-27 при разных уровнях шумов

Таким образом, на основе проведенных исследований с учетом результатов работ /1-3/ мы полагаем, что минимально-фазовый метод может эффективно использоваться при восстановлении пространственной структуры космических радиоисточников по измеренному модулю их фурье-спектра.

Поступила в редакцию  
27 января 1982 г.

#### Л и т е р а т у р а

1. И. Г. Косарев, И. Ф. Малов, В. А. Фролов, Препринт ФИАН № 90, М., 1980 г.
2. А. А. Гальченко и др., Краткие сообщения по физике ФИАН № 2, 8, (1982).
3. А. А. Гальченко и др., Краткие сообщения по физике ФИАН № 2, 24 (1982).
4. А. В. Оппенхайм, Дж. С. Лим, ТИИЭР, 69, 39 (1981).
5. R. H. T. Bates, P. J. Napier, MNRAS, 158, 405 (1972).